Наноструктурирование кристаллических зерен природного алмаза ионизирующим излучением

© Н.А. Поклонский[¶], Т.М. Лапчук, Н.И. Горбачук, В.А. Николаенко*, И.В. Бачучин*

Белорусский государственный университет, 220050 Минск, Белоруссия * Российский научный центр "Курчатовский институт", 123182 Москва, Россия

(Получена 27 декабря 2004 г. Принята к печати 12 января 2005 г.)

Исследованы кристаллические зерна природного алмаза типа II*a* (средняя масса зерна ~ 1 мг), облученные в атомном реакторе флюенсом ~ 10^{21} см⁻² нейтронов. Облучение приводит к уменьшению макроскопической плотности зерна на 40%. Впервые зарегистрирован квадратурный сигнал электронного парамагнитного резонанса с *g*-фактором 2.00006 и временем парамагнитной релаксации > 10^{-5} с. Возможной причиной появления этого сигнала в облученном алмазе являются метастабильные нескомпенсированные электронные спины, находящиеся на внутренней поверхности нанопор. Подобный сигнал наблюдается и в порошке фуллерита C₆₀. Результаты спектроскопии электронного парамагнитного резонанса облученных алмазов согласуются с данными спектроскопии комбинационного рассеяния света (появление аномально широкой полосы с максимумом при 950 см⁻¹ вместо узкой одиночной линии 1332 см⁻¹ в исходном образце) и электронной микроскопии (появление наноструктурированности). Установлено, что наноструктурирование алмаза под воздействием ионизирующего излучения приводит к появлению электропроводности на постоянном токе с энергией активации 0.17 эВ в диапазоне температур 30–300°С.

1. Введение

Алмаз является перспективным материалом электронной техники, использование которого сдерживается отсутствием приемлемых технологий его легирования для формирования слоев *n*-типа электропроводности (см., например, [1,2]). Поэтому актуальным является поиск способов управления электрофизическими свойствами алмаза без изменения его химического состава. Согласно [3], для различных аморфных материалов характерна пространственная наноструктурированность (неоднородность в нанометровом масштабе), т.е. присущая кристаллам периодичность в расположении атомов сохраняется только в пределах нескольких координационных сфер. Нанонеоднородности являются не одиночными образованиями, а фрагментами, из которых целиком построены аморфные материалы, а также стекла. Это позволяет рассматривать ионизирующее излучение, приводящее к разупорядочению кристаллов (а при определенных условиях и к упорядочению [4]), в качестве метода создания новых наноструктурированных материалов и приборных структур на основе алмаза. Цель настоящей работы — изучение свойств кристаллических зерен алмаза, облученных большими флюенсами ионизирующего излучения в атомном реакторе.

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

1. Исследовались монокристаллические зерна природного алмаза типа II*a* (средняя масса зерна — 1 мг). Облучение образцов проводилось в атомном реакторе Российского научного центра "Курчатовский институт". Флюенс нейтронов измерялся детекторами активации из ⁵⁴Fe [5]. Контроль температуры облучения осуществлялся по методу изохронного отжига алмаза или карбида кремния [6]. Температура образцов в ходе облучения выдерживалась около 100°С.

Расширение алмаза определялось по радиационному изменению его плотности $|\Delta \rho / \rho_0|$, где $\rho_0 = 3.55 \, \text{г/cm}^3$ — плотность необлученного алмаза, $\Delta \rho = \rho - \rho_0 < 0$ — уменьшение плотности (расширение) вследствие облучения. Для измерения $|\Delta \rho / \rho_0|$ использовался метод термоградиентной трубки [7]; погрешность определения $|\Delta \rho / \rho_0|$ составила 1%. В работе исследовались исходные и облученные флюенсом $\sim 10^{21} \, \text{см}^{-2}$ нейтронов зерна алмаза с радиационным расширением $|\Delta \rho / \rho_0| \approx 40\%$.

2. Электронно-микроскопическое изображение скола облученного алмаза, полученное с помощью растрового электронного микроскопа LEO 1455 VP (энергия электронов 20 кэВ, ток через образец 20 пА) приведено на рис. 1. На вставке, в центре — скол необлученного алмаза. Изменение морфологии скола (появление "шагреневости") свидетельствует о радиационностимулированном изменении структуры алмаза в нанометровом масштабе.

3. Измерения электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) алмаза проводились в резонаторе H_{102} на частоте 9.3 ГГц сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения мощностью до 70 мВт. Поляризующее магнитное поле модулировалось с частотой 100 кГц. Регистрация спектров ЭПР проводилась при комнатной температуре. В исходных (необлученных) зернах алмаза сигналы ЭПР не наблюдались. В облученных образцах наблюдались (рис. 2, *a*) как синфазный сигнал (фаза опорного напряжения и фаза сигнала ЭПР на входе синхронного

[¶] E-mail: poklonski@bsu.by



Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение скола алмаза, облученного в атомном реакторе флюенсом нейтронов $\sim 10^{21}$ см⁻²; на вставке в центре — скол исходного алмаза.

детектора совпадают, $\varphi = 0^{\circ}$), так и квадратурный (фаза опорного напряжения и фаза сигнала ЭПР отличаются на $\varphi = 90^{\circ}$), свидетельствующие (согласно [8]) о наличии парамагнитных центров (ПЦ), для которых времена релаксации велики (> 10^{-5} с). Отметим, что на спектре ЭПР облученных алмазов при $\varphi = 90^{\circ}$ впервые зарегистрирован сигнал 3, имеющий *g*-фактор 2.00006 и ширину $\Delta B_3 = 0.06$ мТ.

При тех же условиях регистрации ЭПР нами исследовались высокочистые (> 99%) порошки фуллерита С₆₀, экстрагированные с помощью толуола из сажи, полученной при испарении графита в электрической дуге [9]. (Согласно [10], полученный таким же способом порошок фуллерита С₆₀ состоит из кристаллических гранул размером ~ 1-5 мкм). В спектрах ЭПР порошка фуллерита на воздухе регистрировались (рис. 2, b) два типа линий: линия 1 в фазе ($\phi = 0^{\circ}$) с полем высокочастотной (100 кГц) модуляции поляризующего магнитного поля и линия 2 в квадратуре ($\phi = 90^{\circ}$). Ширина линии синфазного (1) сигнала равна $\Delta B_1 = 0.125 \text{ мT};$ $g_1 = 2.00236$. Одновременно с линией (2) наблюдался еще один сигнал (3) с *g*-фактором $g_3 = 2.00002$ и шириной линии $\Delta B_3 = 0.06 \text{ мT}$ (рис. 2, *b*). Отметим, что линии ЭПР $(g_1 = 2.0023, g_3 = 2.000)$ связывались с фуллереном C₆₀ (см., например, [11]).

Для зерен облученного алмаза и порошка фуллерита C_{60} изучались зависимости амплитуд сигналов ЭПР от мощности СВЧ излучения. (Предварительно было установлено, что на ширину, интенсивность и *g*-фактор сигналов ЭПР вакуумирование образцов до 10^{-2} Торр, а также отжиг при температуре 200°С в течение 30 мин на воздухе не оказывают влияния). На рис. 2, *c*, *d* приведены зависимости амплитуд A_1 и A_3 сигналов *I* и *3* облученного алмаза (рис. 2, *a*) и порошка фуллерита C_{60} (рис. 2, *b*) от напряженности H_1 магнитной компоненты СВЧ поля в резонаторе H_{102} . Видно, что характеры насыщения ПЦ, ответственных за линии с *g*-факторами $g_3 = 2.00006$ и $g_3 = 2.00002$ для облученного в реакторе зерна природ-



Рис. 2. *а* — Спектры ЭПР образца ($|\Delta \rho / \rho_0| \approx 40\%$) природного алмаза типа П*a* массой 1 мг; *b* — ЭПР порошка фуллерита С₆₀ массой 2 мг; *I* — $\varphi = 0$, *2*, *3* — $\varphi = 90^\circ$ (измерения при температуре *T* ≈ 300 К и $H_1/H_{1m} = 0.5$); *c*, *d* — зависимости нормированных на максимальные значения A_{1m} и A_{3m} амплитуд A_1 и A_3 сигналов *I* и *3* алмаза (Dia) и порошка фуллерита С₆₀ от величины напряженности H_1 магнитной компоненты СВЧ поля; *с* — регистрация при $\varphi = 0$, *d* — $\varphi = 90^\circ$. (Значение H_{1m} соответствует СВЧ мощности 70 мВт).



Рис. 3. Спектры КРС (при температуре 80 К): *1* — исходный алмаз, *2* — алмаз после облучения, *3* — шунгит (содержание углерода 98 мас.%; интенсивность КРС увеличена в 10 раз).

ного алмаза и порошка фуллерита C_{60} соответственно, близки именно для квадратурного сигнала (ср. рис. 2, *с* и 2, *d*).

Таким образом, и в облученном алмазе, и в порошке фуллерита C_{60} наблюдаются парамагнитные центры с большими (> 10^{-5} с) временами релаксации [12], близкими значениями *g*-факторов, ширин линий, а также сходными характерами зависимостей амплитуд сигналов *3* от величины напряженности H_1 магнитной компоненты СВЧ поля. Возможной причиной появления линии *3* от ПЦ с большими временами релаксации (> 10^{-5} с) и в облученном алмазе, и в порошке фуллерита C_{60} являются нескомпенсированные электронные спины, находящиеся на внутренней поверхности нанопор [13] облученного алмаза и внутри углеродного каркаса отдельных молекул C_{60} (или пор в гранулах порошка фуллерита).

Аргументом в поддержку гипотезы о наличии нескомпенсированных электронных спинов на поверхности нанопор в облученных зернах алмаза является метастабильность только парамагнитных центров, обусловливающих линию 3 на рис. 2, а. При многократном (примерно 30 раз) прохождении через резонанс линия 3 исчезала как на спектрах образцов облученного алмаза, так и на спектрах ЭПР порошка фуллерита C_{60} . Это может быть обусловлено перестройкой спиновой системы, формирующей линию 3, при стимулированной измерениями ЭПР релаксации полей упругих напряжений [14] в облученном алмазе. В работе [15] продемонстрировано увеличение (в сотни раз) скорости подобной перестройки спиновой системы при измерении ЭПР в пористых структурах.

4. Комбинационное рассеяние света (КРС) в зернах алмаза возбуждалось Nd: YAG-лазером (длина волны $\lambda = 1064$ нм, мощность излучения — от 30 до 500 мВт). Регистрация спектров КРС проводилась при температуре 80 К в геометрии рассеяния назад.

На рис. 3 представлены спектры КРС исходного (1) и облученного (2) алмазов, а также, для сравнения,

природного наноструктурного материала — шунгита (3). Как следует из рис. 3, изменение структуры алмаза вследствие облучения проявляется в появлении в КРС аномально широкой полосы с максимумом при 950 см⁻¹ и исчезновении узкой одиночной линии 1332 см⁻¹. Для углеродных наноструктурных материалов, содержащих кластеры графеновых слоев с *s p*²-гибридизованными связями, характерно присутствие полос D и G в спектрах КРС (см., например, [16-18]). К таким материалам относятся шунгит (рис. 3, спектр 3), ультрадисперсные алмазы. Отметим, что следы природных фуллеренов С₆₀ обнаружены в шунгите [19]. Полосы G и D в спектрах КРС нанопористого углерода, а также в спектрах аморфного гидрогенизированного углерода обычно не разделяются, и одна широкая полоса имеет максимум в интервале 1300–1600 см⁻¹. Насколько нам известно, максимумы широких полос КРС этих материалов не находятся вблизи значения 950 см⁻¹. Однако в спектрах КРС фуллеритов и углеродных нанотрубок наблюдается ряд полос [11,20] в диапазоне 300-1000 см⁻¹. Поэтому вероятной причиной смещения максимума спектра 2 в окрестность 950 см⁻¹ является присутствие в объеме облученного алмаза наноструктур (или нанопор) с искривленными графеновыми плоскостями. Возможность образования дефектов с искривленными графеновыми плоскостями показана в [21].

5. Измерения электропроводности на постоянном токе выполнялись по стандартной методике. Электрические контакты к зернам алмаза наносили серебряной пастой. Зерна алмаза становились проводниками электричества только после облучения в реакторе. В диапазоне температур от 30 до 300°С энергия активации электропроводности алмазов (с расширением $|\Delta \rho / \rho_0| \approx 40\%$) составляет 0.17 эВ. Возможно, что эта термическая энергия активации электропроводности обусловлена проявлением прыжкового переноса электронов по собственным радиационным дефектам [22] вследствие "пленения" ими уровня Ферми [23].

3. Заключение

Облучение зерен природного алмаза типа II*a* в атомном реакторе флюенсом ~ 10^{21} см⁻² нейтронов приводит наряду с радиационным уменьшением плотности на 40% к изменению морфологии скола (появление неоднородности в нанометровом масштабе). Радиационная перестройка структуры зерен алмазов сопровождается: 1) появлением квадратурного сигнала ЭПР ($g_3 = 2.00006$) от метастабильных парамагнитных центров с временами парамагнитной релаксации > 10^{-5} с; 2) появлением в спектре КРС аномально широкой полосы с максимумом при 950 см⁻¹ и исчезновением узкой одиночной линии 1332 см⁻¹; 3) переходом в электропроводящее состояние с энергией активации 0.17 эВ проводимости на постоянном токе в диапазоне температур 30–300°С.

Список литературы

- С.К. Итон, Ю.Е. Евстефеева, Дж.К. Энгус, А.Б. Эндерсон, Ю.В. Плесков. Электрохимия, **39** (2), 170 (2003).
- [2] В.С. Вавилов. УФН, 167 (1), 17 (1997).
- [3] В.К. Малиновский. ФТТ, 41 (5), 805 (1999).
- [4] И.П. Чернов, А.А. Мамонтов, П.А. Черданцев, Б.В. Чахлов. Изв. вузов. Физика, 37 (12), 58 (1994).
- [5] S.M. Zaritsky, P.A. Platonov, Yu.A. Nikolaev, B. Osmera, V. Valenta. In: *Reactor Dosimetry: Radiation Metrology and Assessment*, ASTM STP 1398 (American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, 2001) p. 53.
- [6] В.А. Николаенко, В.И. Карпухин. Измерение температуры с помощью облученных материалов (М., Энергоатомиздат, 1986).
- [7] М.Я. Кац. Новые методы исследования минералов в гравитационном поле (М., Наука, 1966).
- [8] J.R. Harbridge, G.A. Rinard, R.W. Quine, S.S. Eaton, G.R. Eaton. J. Magn. Res., 156 (1), 41 (2002).
- [9] В.Д. Шиманович, А.И. Золотовский, И.П. Смягликов, С.М. Панковец. ЖПС, 68 (3), 393 (2001).
- [10] Э.М. Шпилевский. В сб.: Алмазные пленки и пленки родственных материалов (ННЦ ХФТИ, Харьков, Констаната, 2003) с. 242.
- [11] C.A. Reed, R.D. Bolskar. Chem. Rev., 100 (3), 1075 (2000).
- [12] Н.А. Поклонский, Т.М. Лапчук, Н.М. Лапчук. Аморфные и микрокристаллические полупроводники: Сб. тр. IV Межд. конф. С.-Петербург, 5–7 июля 2004 г. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб., 2004) с. 91.
- [13] Э.Л. Нагаев. ЖЭТФ, 100 (3(9)), 961 (1991).
- [14] Р.Б. Моргунов. УФН, 174 (2), 131 (2004).
- [15] Н.А. Поклонский, И.В. Потоцкий, Н.И. Горбачук. Аморфные и микрокристаллические полупроводники: Сб. тр. IV Межд. конф., С.-Петербург, 5–7 июля 2004 г. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб., 2004) с. 151.
- [16] С.В. Холодкевич, В.И. Березкин, В.Ю. Давыдов. ФТТ, 41 (8), 1412 (1999).
- [17] А.М. Данишевский, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев, А.В. Гречинская. ФТТ, 43 (1), 132 (2001).
- [18] А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.Ю. Давыдов, Ю.А. Певцова. ФТТ, **39** (6), 1125 (1997).
- [19] В.А. Резников, Ю.С. Полеховский. Письма ЖТФ, 26 (15), 94 (2000).
- [20] P.J. Horoyski, M.L.W. Thewalt, T.R. Anthony. Phys. Rev. B, 54 (2), 920 (1996).
- [21] М.И. Новгородова. ДАН, **367** (2), 241 (1999).
- [22] R. Coates, E.W.J. Mitchell. Adv. Phys., 24 (5), 593 (1975).
- [23] V.N. Brudnyi, S.N. Grinyaev, V.E. Stepanov. Physica B, 212 (4), 429 (1995).

Редактор Л.В. Беляков

Nanostructuring of crystalline grains of the natural diamond by ionizing radiation

N.A. Poklonski, T.M. Lapchuk, N.I. Gorbachuk, V.A. Nikolaenko*, I.V. Bachuchin*

Belarusian State University, 220050 Minsk, Belarus * Russian Research Center "Kurchatov Institute", 123182 Moscow, Russia

Abstract The crystalline grains of natural II*a* type diamond (average grain mass $\sim 1 \text{ mg}$) irradiated by neutron flux $\sim 10^{21} \text{ cm}^{-2}$ in the nuclear reactor have been investigated. Irradiation leads to 40% decrease of grain macroscopic density. 90°-Out-of-phase ESR-signal with g-factor 2.00006 and paramagnetic relaxation time $> 10^{-5}$ s is detected for the first time. The possible reason of this signal appearance in irradiated diamond are the metastable non-compensated spins located on the inner surface of nanopores. Similar signal is observed in the C_{60} fullerene powder. ESR-spectroscopy results of irradiated diamonds are agreed with Raman scattering data (anomalously wide band with maximum at 950 cm⁻¹ as a result of radiation instead of narrow single line $1332 \,\mathrm{cm}^{-1}$ in non-treated sample) and electron microscopy data (appearance of nanostructuring). It is established, that nanostructuring of diamond by ionizing radiation leads to appearance of dc-electroconductivity with activation energy 0.17 eV in the temperature range $30-300^{\circ}$ C.